

IP Intelligence Software “INNOGRAPHY” のご紹介

INNOGRAPHY というツールをご存知でしょうか？ 2018 年 9 月、日本のお客様に対してご案内を開始してから、はや 1 年半が経過致しました。お陰様でご契約企業様の数も NGB スタッフの予測を上回るペースで増えております。そんな INNOGRAPHY を皆様にもっと知って頂くため、4 月より、利用目的別の INNOGRAPHY 特徴機能を連載形式にてご紹介しております。

今回はその第 2 回目ということで、「INNOGRAPHY 活用シーン 02：研究開発戦略の策定」を想定しながら、INNOGRAPHY の特徴機能をご紹介させていただきます。

INNOGRAPHY 活用シーン 02：研究開発戦略の策定

活用機能

- ・ Custom4D「分類/国/年」×「件数/スコア」
- ・ 「IPC/CPC/USC マップ」×「スコアリング」等
- ・ 「出願国/出願年」×「IP コスト」
- ・ 「発明者」×「スコアリング」
- ・ テキスト・クラスタリング

活用事例紹介

- ・ 自社保有特許の現状を客観的指標から知る
- ・ 各企業が保有する保有特許の現状・評価を知る
- ・ 出願・投資状況を知りホワイトスペースを探す
- ・ 注目すべき発明者から技術トレンドを知る
- ・ キーワードを基に出願状況を知りホワイトスペースを探す

なお、6 月以降は以下の利用目的を想定した特徴機能をご紹介する予定です。

INNOGRAPHY 活用シーン 03：競合分析

INNOGRAPHY 活用シーン 04：技術動向・先行技術調査

INNOGRAPHY 活用シーン 05：M&A、提携先候補の調査

INNOGRAPHY 活用シーン 06：PatentIQ 情報共有機能（自動更新機能あり）

INNOGRAPHY 活用シーン 07：PortfolioIQ 独自情報の活用機能（オプション）

INNOGRAPHY 活用シーン 02：研究開発戦略の策定

活用機能

- ・ Custom4D「分類/国/年」×「件数/スコア」
- ・ 「IPC/CPC/USC マップ」×「スコアリング」等
- ・ 「出願国/出願年」×「IP コスト」
- ・ 「発明者」×「スコアリング」
- ・ テキスト・クラスタリング

活用事例紹介

- ・ 自社保有特許の現状を客観的指標から知る
- ・ 各企業が保有する保有特許の現状・評価を知る
- ・ 出願・投資状況を知りホワイトスペースを探す
- ・ 注目すべき発明者から技術トレンドを知る
- ・ キーワードを基に出願状況を知りホワイトスペースを探す

Custom4D

自社保有特許の状況を客観的指標から知る

研究開発戦略の策定に際し、まずは自社の研究開発動向を確認します。

自社保有特許を対象に Custom4D モードを用いて「特許分類/出願国/出願年/公開年/失効年」と「件数/スコアリング/IP コスト/引用数/クレーム数/発明者数」等複数の客観的データからチャートを作成することができます。

これらの分析に Custom4D 表示形式を用いれば、横軸（X）、縦軸（Y）、係数（Z）をある一定の範囲から自由に選択することが可能です。



Custom4D の表示形式には Heatmap、Bubble、Line、Bar 等が用意されています。

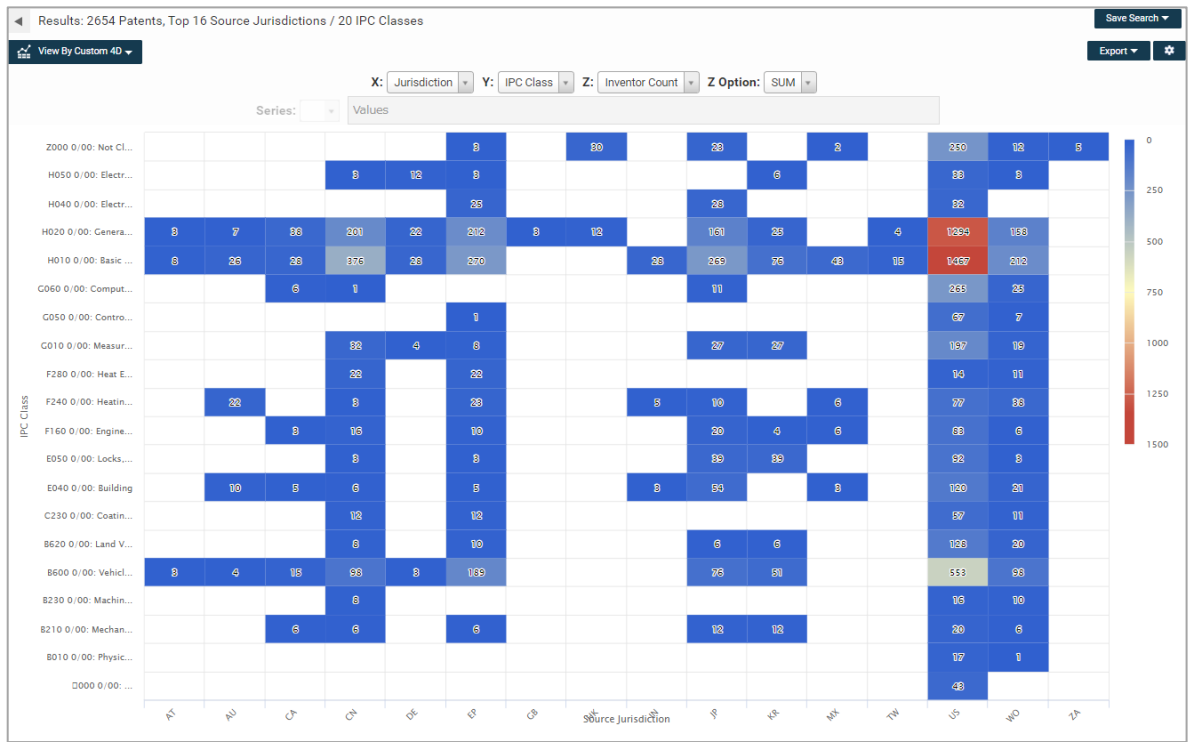
Chart options vs Chart types

Grouping	Bar	Line	Mrkt	Heat
X axis	Yes	Yes	Yes	Yes
Y axis	Yes	Yes	Yes	Yes
Z axis			Yes	Yes
Z option	Yes*	Yes*	Yes	Yes
Series	Yes	Yes	Yes	

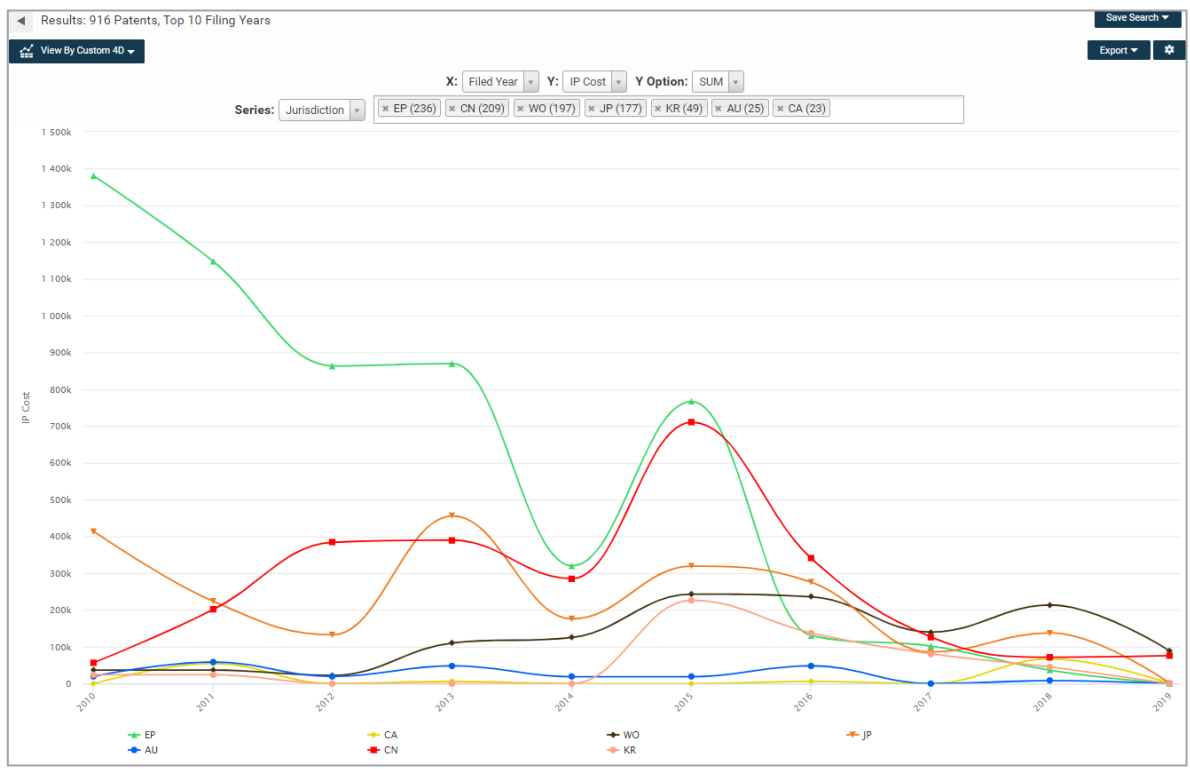
以下、Custom4Dにて選択可能な項目一覧です。表示中のマップはリファイン・ボードを用いて、前提条件を簡単に追加・変更することが可能です。

Series	X 軸 & Y 軸	Z 軸	Z 軸オプション
Organization	Organization	Count	SUM
Jurisdiction	Jurisdiction	Age	AVG
CPC/Section	CPC/Section	Forward Citations	MIN
IPC/Section	CPC/Class	Backward Citations	MAX
USC/Section	CPC/Subclass	Claims	
Original Organization	CPC/Group	Inventor Count	
Inventor	IPC/Section	Rejection Type Count	
Examiner	IPC/Class	Remaining Life	
Rejection Type	IPC/Subclass	Relevance	
Art Unit	IPC/Group	PatentStrength	
Filed Year	USC/Section	First Claim Word Count	
Priority Year	USC/Class	IP Cost	
Publish Year	USC/Subclass L1	Litigation Count	
Expiration Year	USC/Subclass	CustomStrength	
Project Label	Original Organization		
Agent	Inventor		
Law Firm	Examiner		
PortfolioIQ	Rejection Type		
	Art Unit		
	Filed Year		
	Priority Year		
	Publish Year		
	Expiration Year		
	Project Label		
	Agent		
	Law Firm		
	PortfolioIQ		

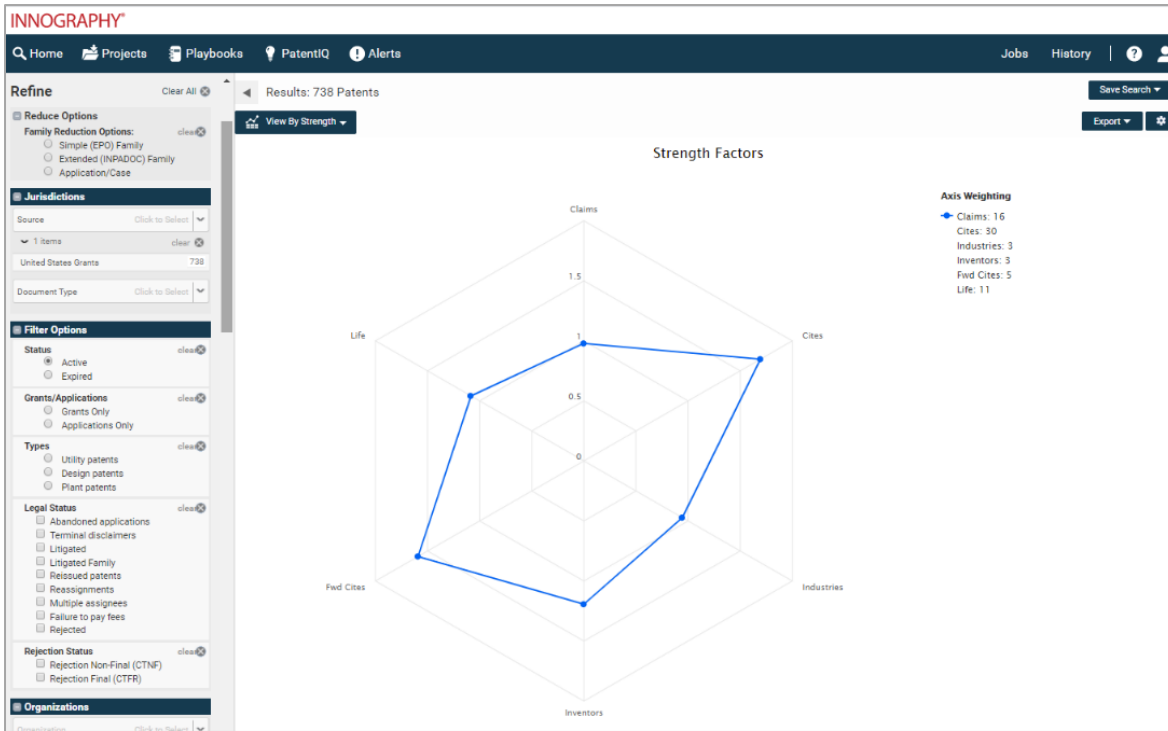
以下、Custom4D 表示形式を用いたサンプルです。



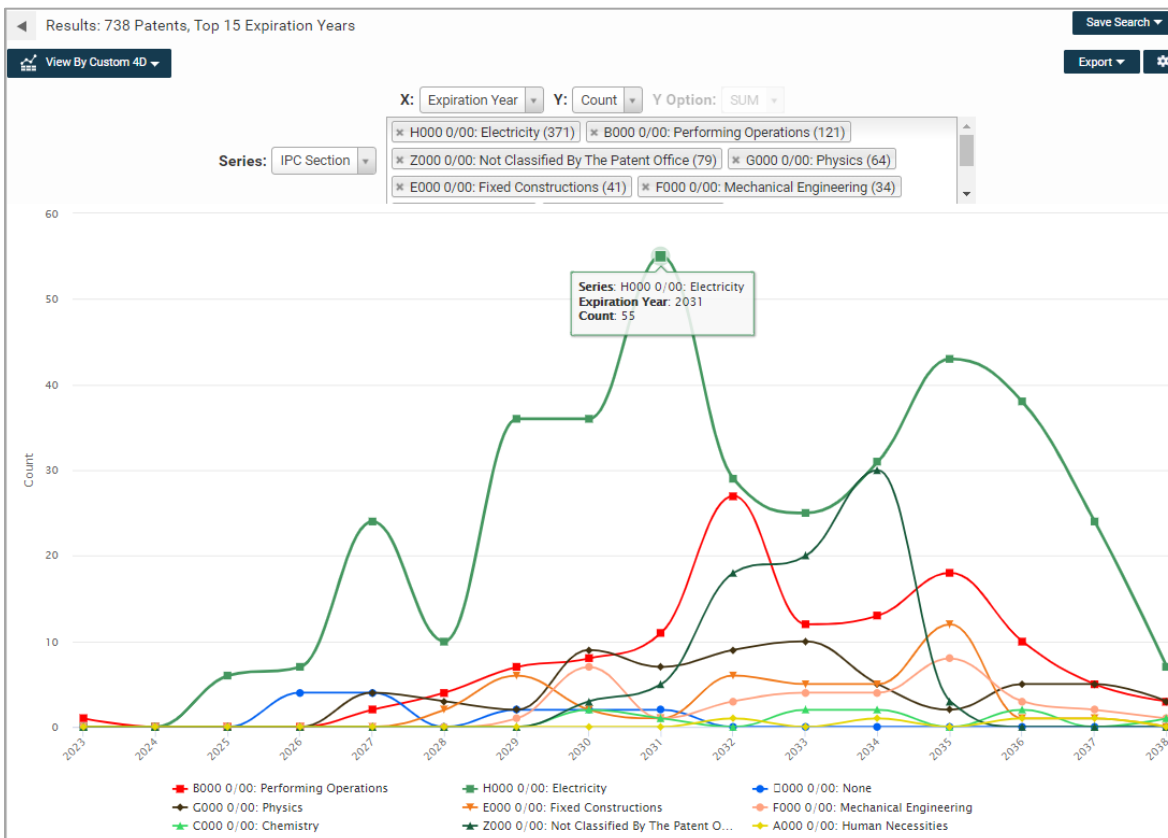
X : 地域
Y : IPC
Z : 発明者数



Series : 地域
X : 出願年
Y : IP コスト



USP/Active 案件を対象にした分析 (Rader Chart/Strength Factors)

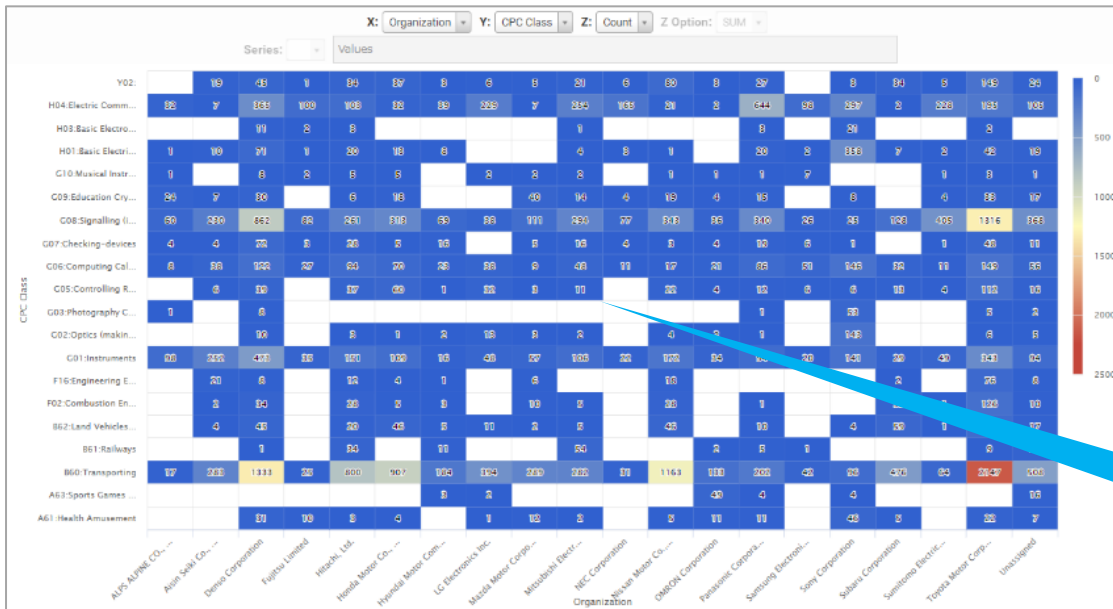


USP/Active 案件を対象にした分析 Series : IPC X : 失効年 Y : 件数 (Custom4D)

「IPC/CPC/USC マップ」×スコアリング、Success Rate

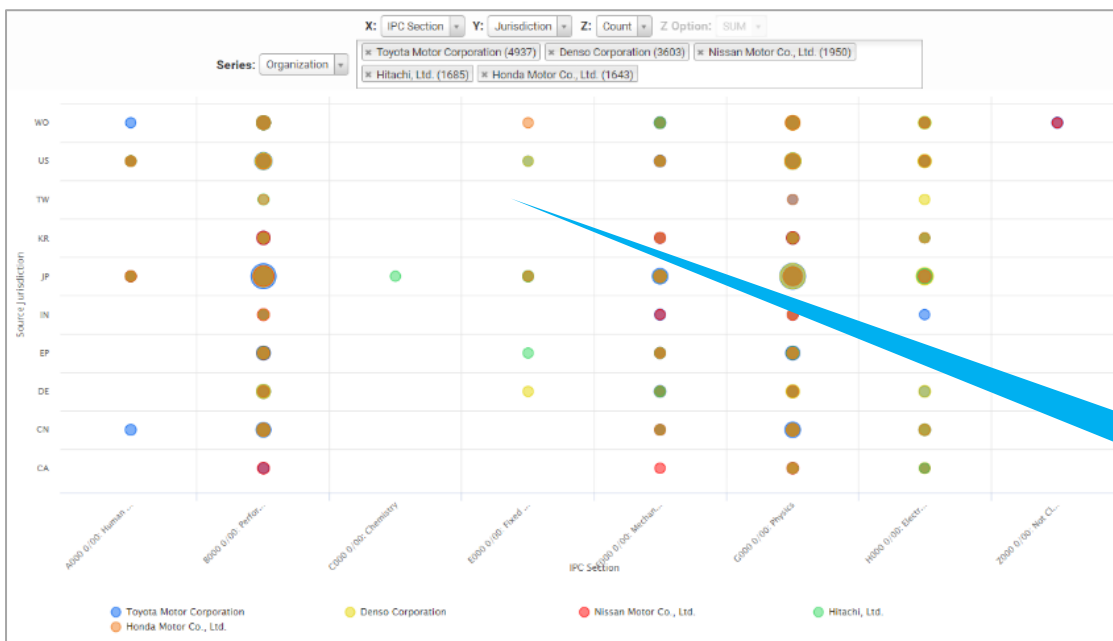
各企業が保有する特許の現状・評価を知る

各企業が保有する特許を分類別件数、スコアリング等複数の観点から分析し、ホワイトスペースの探索や重複排除の可能性を知ることができます。



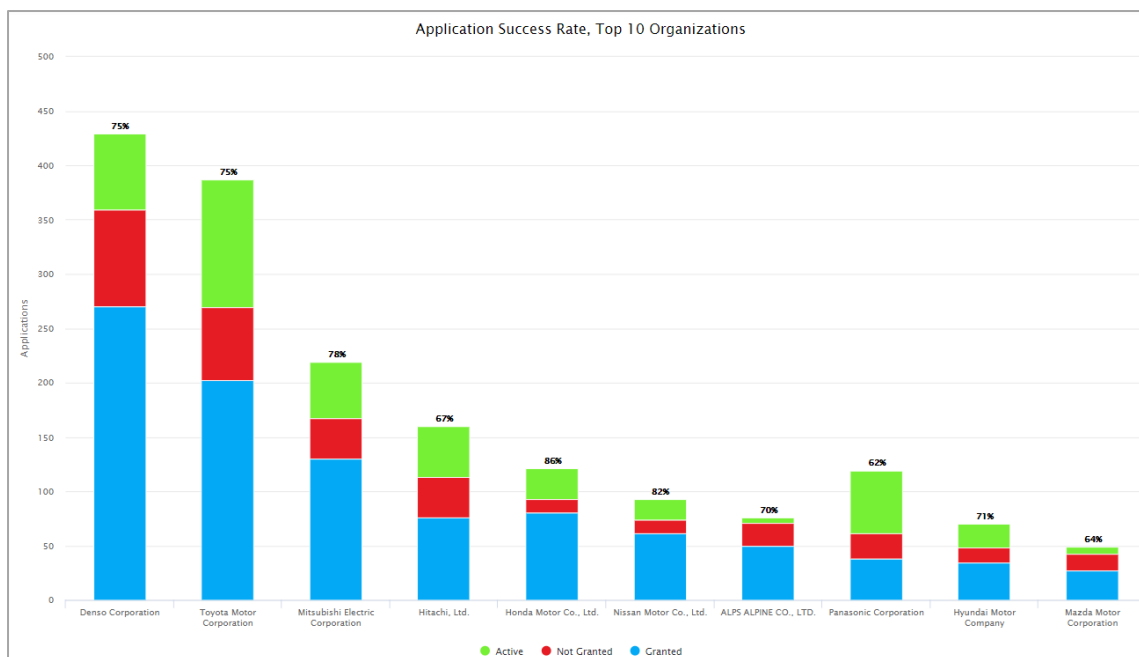
X : 出願人
Y : CPC
Z : 件数

Blank spaces are
white space
possibilities



Series : 出願人
X : IPC
Y : 地域
Z : 件数

Blank spaces are
white space
possibilities



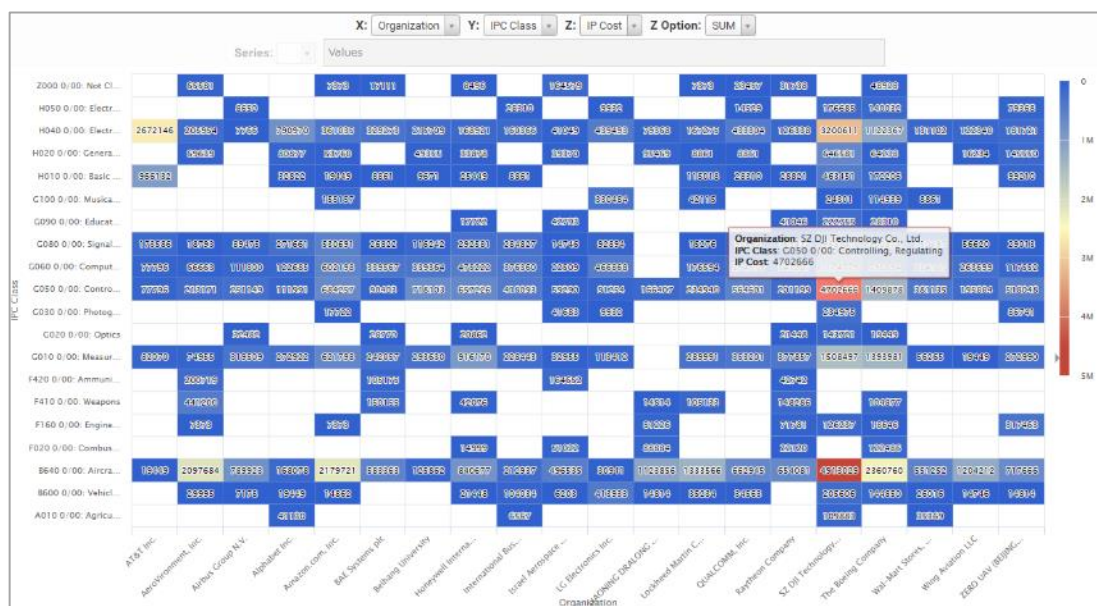
Success Rate のデータを分析することで各社の課題（登録率の低い技術、分野等）を知ることも可能です。自社保有特許のライセンス先候補、パートナー候補として検討することも可能です。

「出願国/出願年」×「IP コスト」

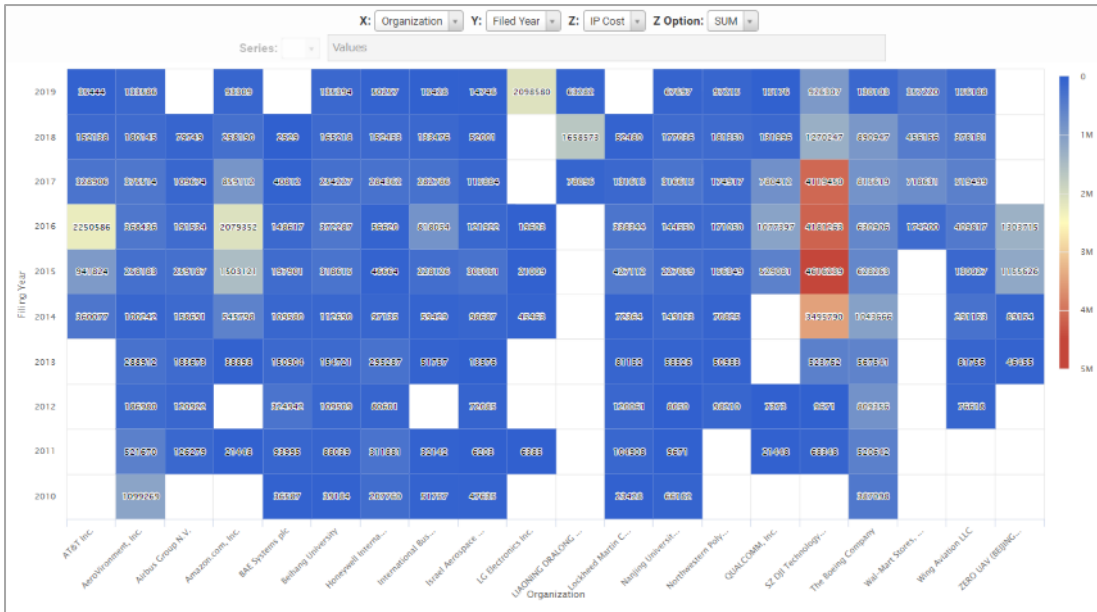
各社の出願・投資状況を知りホワイトスペースを探す

「出願年/出願国/特許分類/発明者」等の複数の観点から各社の出願・投資状況を分析し、ホワイトスペースの探索や重複排除の可能性を知ることができます。

これらの分析に Custom4D 表示形式を用いれば、横軸 (X)、縦軸 (Y)、係数 (Z) をある一定の範囲から自由に選択することが可能です。



X : 出願人
Y : IPC
Z : IP コスト



X : 出願人
Y : 出願年
Z : IPコスト

発明者×スコアリング

注目すべき発明者から技術トレンドを知る

発明者情報とその他関連する情報（発明者別評価、発明者別 IP コスト、発明者数）等を組み合わせて、発明者に関する情報を知ることができます。



Series : 出願年
X : 出願人
Y : 出願国
Z : 発明者数



X : 出願年
Y : 発明者
Z : IP コスト

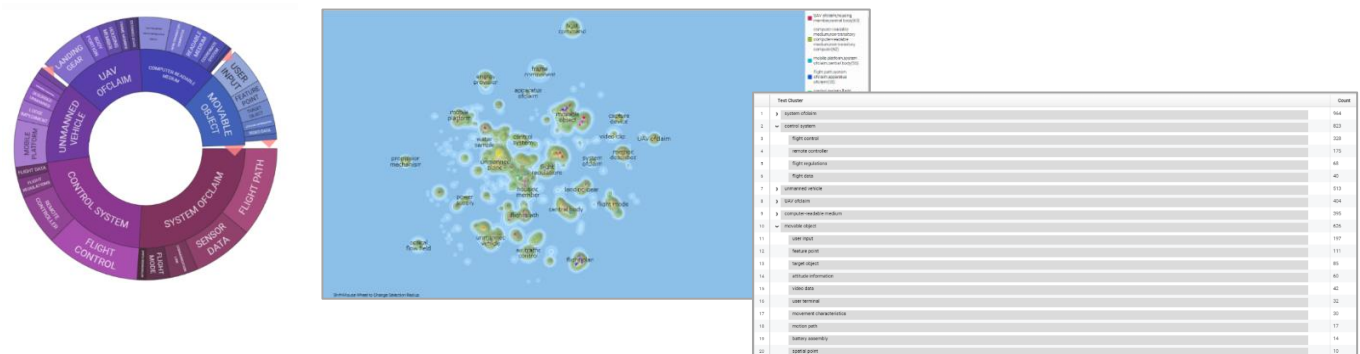


X : 発明者
Y : 出願国
Z : PatentStrength

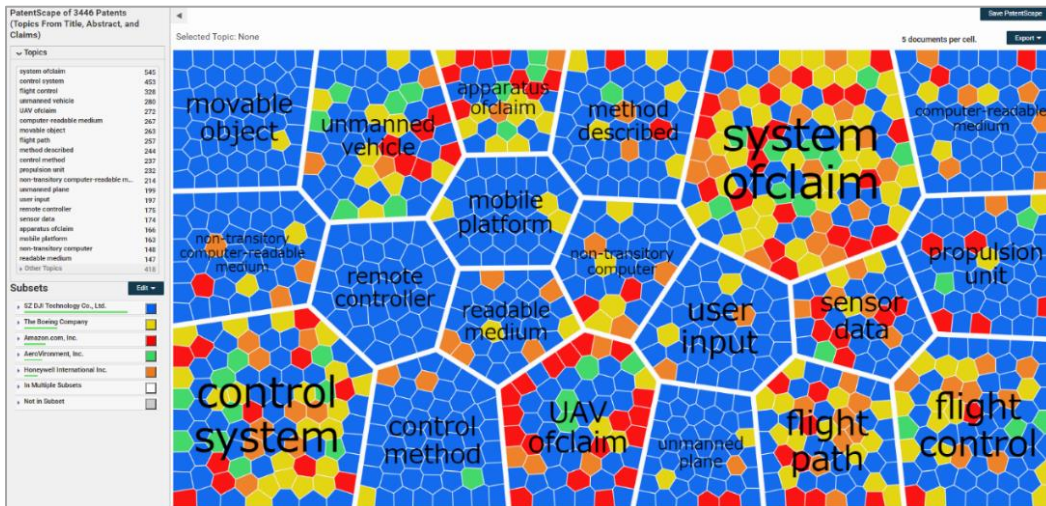
テキスト・クラスタリング

キーワードを基に出願状況を知りホワイトスペースを探す

公報上のキーワードを基にクラスタリングを行い、分析を行うことができます。テキスト・クラスタリング機能を用いた表示形式は左の「Circles」、下記の「Terrain」、 「Grouped」の3タイプが用意されています。



Text Cluster の関連機能として PatentScape 機能を有しています。キーワードをグループ化し、そのグループ内の分布状況を知ることができます。出願がどのキーワード群に集中しているのかを知ることができます。



PatentScape : 各キーワード群における出願人別の権利取得状況をチャートから一覧、さらには詳細情報を確認することができます。大きなハニカム・チャート内においては、キーワード群の中心に近い程、表示されているキーワードに関連度が高い特許が配置されます。例えば、「fixed plate」においては赤いセルの出願人が保有する特許が、そのキーワード群においては関連度が高い特許を保有していることを示します。なお、小さなセルが示す特許件数は分析対象とする集合の件数によって異なります。

以上、Innography を利用した場合の目的別活用例をご紹介しました。ご不明な点がございましたら、下記窓口までお問い合わせ下さい。

日本技術貿易株式会社 IP 総研

長谷川 mhasegawa@ngb.co.jp

菊田 momoko.kikuta@ngb.co.jp

饗庭 yuna.aiba@ngb.co.jp